



Fig.3 Sample current spectra (a) and TEY-XAS (b) in the 200~750 eV region of the samples, measured in BL-6.3.2/ALS.

BL-6.3.2/ALS で測定した C K 端の試料電流スペクトルと TEY-XAS を Fig.4 (a), (b) に示す。なお、C K 端 XANES は 285 eV 以上の構造であるが、265 eV 付近から立ち上がる構造は O K 端の 2 次回折光である。このように O K 端の 2 次回折光が顕著に現れるのは、前述したように BL-6.3.2 のビームライン分光器の定偏角が 172° と広いためである。試料電流が 10 pA 以下の紙

(PWP, CPF64, CPF78, CPN105, FPP) とテープ (PIT50, PIT55, S3M) の TEY-XANES では C K 端 XANES が観測されるものの、これ以上に O K 端の 2 次回折構造が強く観測された。一方、試料電流が 20 pA 程度流れる布 (WCR, WCC, WCV) では、O K 端の 2 次回折構造は低く、C K 端 XANES が明瞭に観測できた。なお、酸素を組成として含まない PTFE の試料電流は 1 pA